(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開母号 特開2003-282513 (P2003-282513A)

(43)公開日 平成15年10月3日(2003.10.3)

(51) Int.CL'		級別記号		FI			テーマユード(参考)	
HOIL	21/304	642		HOIL	21/304	4	642A	4G068
		647					647Z	4G075
B01J	4/00	101		B01J	4/00		101	5 F 0 4 3
	19/10				19/10			5 P 0 4 6
	21/027			H01L	21/30		572B	
11012	52, 02.		农脑查客	未請求 苗求			(全 6 頁)	最終質に続く
(21)出顧番号		特爾2002-85385(P200	2-85335)	(71)出底	•	002369 (コーエブ	ソン株式会社	
(on) three E		平成14年3月26日(2002	2 9 26)				西新宿2丁目	
(22)出窗日			(72) 発明		第 昭則			
				(16/363.			大 野3丁目3	番5号 セイコ
						Cプソン株		, до , , , , , , ,
				(74)代理		110858	74.24 ELF 3	
				(147)43		里士 柳瀬	HEARING (A	13名)
					ý.	# 13PR#	BESSER C	FO-E/
								具数質に対く

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機物剥離方法及び有機物剥離装置

(57)【要約】

【課題】有機物除去についてその業液寿命の延命化及び 高効率処理を可能とする有機物剥離方法及び有機物剥離 装置を提供する。

【解決手段】有機物を剥離する処理槽に所定の薬液を蓄 える(処理S1)。一方、別捨では上記葉液内に活性程 として加えられるべき液体をミスト化しておく(処理S 2)。ミスト化された液体が清浄ガスと混合され処理情 内へ泡状になって供給される(処理53)。この状態で 彼処理物が処理槽に投入され、有機物の剥離処理が行わ れる。彼処理物は、例えば剥離すべきレジスト層の付い た半導体ウェハ、また、パーティクル除去すべき半導体 ウェハ、また、その他の加工品、各種製造装置内の部品 等。有機物除去したいものであれば適用できる。薬液 は、例えば硫酸ー過酸化水素水泥台渡であって、ミスト 化する液体は過酸化水素水である。

